

产品优势

1. 桌面XAFS系统

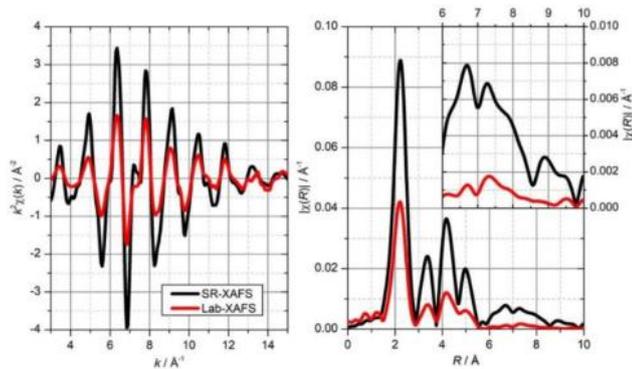
- 首个基于实验室的EXAFS和XANES集成解决方案
- 无需申请和等待光束时间
- 快速多色采集
- 提供光谱分析软件套件

2. 同步加速器质量光谱

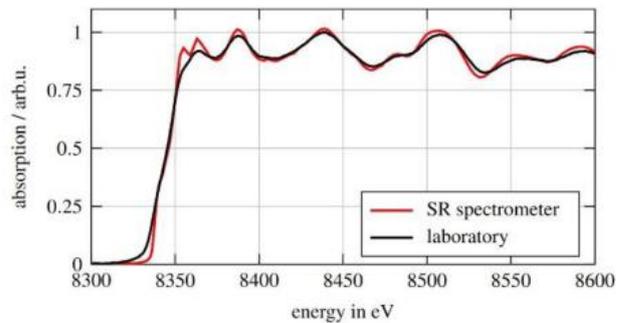
- 能量范围为5-12keV
- 4000的高分辨率
- 带宽可达1keV
- 对几wt%的分析物浓度具有极高的灵敏度
- 可在EXAFS和XANES模式间灵活切换

应用

- 地质、生物学、材料研究的化学状态分析
- 提供有关原子距离、氧化态、配位数的信息
- 三维过渡金属K吸收边的分析



10um 铜箔的 XAFS 测量样本，比较了实验室（红色）和同步加速器（黑色）结果。EXAFS 振荡（左）和相应的傅立叶变换（右）。
采集时间：有样品3分钟，无样品1.5分钟。
J. Anal. At. Spectrom. 35 2298 (2020)



6um厚镍箔的X射线吸收光谱。与在同步加速器（NSLS，分辨率 $E/\Delta E=5000$ ）上获得的光谱进行比较，显示了台式仪器的高质量结果。所有相关光谱特征均存在，可用于化合物的测定

规格参数

项目	内容
系统构成	X射线管源 von Hamos HAPG 光谱仪 混合探测器
能量范围	5-12keV
分析物浓度	下降到几个wt%
样品支架	多个样品的转台安装
占用空间	2.0m x 1.0m
软件套装	集成系统控制，多种光谱校准和分析功能于一体

	EXAFS模式	XANES模式
分辨率	1800	4000
能量带通	1000eV	300eV
采集时间	3min	8min
	在整个能量范围内保持恒定	
	标准化为分析物浓度	